

RCJ発行資料一覧と価格表

		領布価格 (円)	
		(消費税別)	
		会員	一般
シンポジウム	1論文当たり	500	2000

故障物理委員会成果報告

資料番号	資料名	会員	一般
R-53-RS-01	半導体工業におけるエレクトロマイグレーションに関する文献調査(I)	5000	8000
R-53-RS-03	半導体工業におけるエレクトロマイグレーションに関する文献調査(II)	5000	8000
R-56-RS-02	半導体デバイスの信頼性に関する文献動向調査	5000	8000
R-57-RS-03	化合物半導体デバイスの信頼性に関する文献動向調査(その1)	5000	8000
R-58-RS-04	化合物半導体デバイスの信頼性に関する文献動向調査(その2)	5000	8000
R-59-RS-04	プラスチック封止半導体デバイスの信頼性評価に関する文献調査	5000	8000
R-61-RS-02	半導体集積回路におけるエレクトロマイグレーションに関する文献調査	5000	8000
R-63-RS-03	半導体デバイスの故障解析技術	5000	8000
R-2-RS-02	LSIの故障モデル式と加速寿命試験に関する調査研究成果報告書	5000	8000
R-3-RS-02	応力と半導体集積回路の信頼性に関する調査研究中間報告書	5000	8000
R-4-RS-01	応力と半導体集積回路の信頼性に関する調査研究報告書	5000	8000
R-5-RS-02	半導体集積回路のインプロセスの信頼性技術に関する調査中間報告書	5000	8000
R-6-RS-02	半導体集積回路のインプロセスの信頼性技術に関する調査報告	5000	8000
R-7-RS-01	半導体故障物理研究委員会成果中間報告書 -主としてVLSIの信頼性設計に用いる半導体信頼性評価用TEGのガイドラインの検討-	5000	8000
R-8-RS-01	半導体故障物理研究委員会成果中間報告書 -LSI信頼性設計・評価用TEG(エレクトロマイグレーション、ホットキャリア評価用TEGについて)-	5000	8000
R-9-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -最新フラッシュメモリ技術の信頼性-	5000	8000
R-10-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -最新フラッシュメモリ技術及びLSI加工応用マイクロマシン技術の信頼性-	5000	8000
R-11-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -薄層ゲート酸化膜の信頼性を中心として-	5000	8000
R-12-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書	5000	8000
R-13-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -最新VLSI 要素技術(酸化膜と多層配線)の故障物理と信頼性から見たSi 半導体技術の限界-	5000	8000
R-14-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -最新VLSI 要素技術(酸化膜と多層配線)の信頼性と微細化限界-	5000	8000
R-15-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -最新ULSI 要素技術の故障物理とバーンイン技術-	5000	8000
R-16-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -バーンイン技術と最新ULSI 信頼性の話題-	5000	8000
R-17-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -最新ULSI 故障物理及び最新不揮発性メモリ技術と信頼性-	5000	8000
R-18-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -次世代技術ロードマップと信頼性課題-	5000	8000
R-19-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -負バイアス温度不安定性現象(NBTI)を中心として-	5000	8000
R-20-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -負バイアス温度不安定性(NBTI)現象とランダム・テレグラフ・シグナル(RTS)ノイズ現象-	5000	8000
R-21-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -LSI のばらつきと信頼性及び最近の話題(NBTI、信頼性保証)-	5000	8000
R-23-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -負バイアス温度不安定性現象(NBTI)と中性子線ソフトエラー-	5000	8000
R-24-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -パワー半導体信頼性、ばらつきと信頼性及び中性子線ソフトエラー-	5000	8000

R-25-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 -新しい電子材料・電子デバイス、パワー半導体の動向と信頼性、及び LSI の信頼性-	5000	8000
------------	--	------	------

静電気対策委員会報告書

資料番号	資料名	会員	一般
R-59-ES-01	半導体デバイスの静電気破壊現象とその評価方法に関する調査研究成果報告書	5000	8000
R-60-ES-01	半導体デバイスの静電気破壊現象とその評価方法に関する調査研究成果報告書(Ⅱ)	5000	8000
R-61-ES-01	半導体デバイスの静電気破壊現象とその評価方法に関するガイドライン	5000	8000
R-62-ES-01	静電気対策用資材評価のための測定方法に関する調査研究成果報告書	5000	8000
R-62-ES-02	半導体デバイスの静電気破壊現象とその評価方法に関するガイドライン付属書	5000	8000
R-63-ES-01	静電気対策用資材評価技術に関する調査研究成果報告書	5000	8000
R-1-ES-01	半導体デバイスのESD耐性評価試験技術の動向セミナー資料	5000	8000
R-1-ES-02	静電気対策用資材評価技術に関するガイドライン	5000	8000
R-2-ES-01	静電気(ESD)対策に関するセミナー資料	5000	8000
R-2-ES-02	静電気(ESD)対策調査研究成果報告書	5000	8000
R-2-ES-03	静電気(ESD)障害対策調査研究成果報告書	5000	8000
R-3-ES-01	静電気(ESD)対策調査研究成果報告書	5000	8000
RCJS-0950-1993	静電気に敏感なデバイス及び装置の取扱いに関するガイドライン	5000	8000
RC0S-0901-1993	ESD用語集 第1版(暫定)	5000	8000
R-5-ES-01	デバイスの静電気耐性評価試験規格に関する調査研究成果報告	5000	8000
R-5-ES-02	イオナイザの規格に関する動向調査研究成果報告	5000	8000
R-6-ES-01	半導体デバイスの静電気障害回避技術に関するガイドライン	5000	8000
R-6-ES-02	半導体デバイス等の生産現場に使用するイオナイザー活用ハンドブック	5000	8000
RCJS-0950A-1996	静電気に敏感なデバイス及び装置の取扱いに関するガイドライン	5000	8000
RCJS-0901A-1996	ESD用語集 第2版	5000	8000
R-8-ES-01	静電気放電(ESD)対策に関する調査研究成果報告書	5000	8000
R-8-ES-02	新発電システムの静電気対策の標準化に関する調査研究	5000	8000
R-9-ES-01	ESD(静電気放電)に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究成果報告書	5000	8000
R-9-ES-02	新発電システムの静電気対策の標準化に関する調査研究	5000	8000
R-10-ES-01	ESD(静電気放電)に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究(上) -半導体デバイスの静電気障害とその周辺-	5000	8000
R-10-ES-02	ESD(静電気放電)に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究(下) -静電気対策用資材・機器とその周辺-	5000	8000
RCJS-0950A-1999	ESD用語集 第3版	5000	8000
R-11-ES-01	静電気放電(ESD)対策に関する調査研究成果報告書	5000	8000
R-12-ES-01	静電気放電(ESD)対策に関する調査研究成果報告書	5000	8000
R-13-ES-01	静電気放電(ESD)対策に関する調査研究成果報告書 -電子デバイスのESD障害防止対策及び静電気測定器活用ガイド-	5000	8000

信頼性関係報告書

資料番号	資料名	会員	一般
R-25-RC-01	平成25年度電子部品信頼性研究委員会成果報告 -機能安全規格の解説とSIL(ASIL)評価のための電子部品故障率予測ガイドライン-	8000	12000
R-26-RC-01	平成26年度電子部品信頼性研究委員会成果報告 -ハードウェアのSIL(ASIL)評価例及びFIDES(電子部品故障率モデル)の解説と算出例-	8000	12000
R-27-RC-01	平成27年度電子部品信頼性調査研究委員会研究成果報告書 -機能安全規格の動向及び電子部品故障率モデルのIEC/TR 61380、FIDES及び217Plusを用いた故障率算出例と比較-	8000	12000
R-51-E-02	有害ガス雰囲気及び日射環境条件における試験技術の確立に関する調査研究成果報告書	5000	8000
R-52-E-02	昭和51年度 有害ガス雰囲気及び日射環境条件における試験技術の確立に関する調査研究成果報告書	5000	8000

R-8-EC-01	電子部品の故障率の基準条件及び換算のためのストレスモデル IEC 1709 仮訳	5000	8000
RCJS-2000A-1994	個別半導体デバイス及び集積回路の共通仕様書 (IEC 747-10に準拠)	5000	8000
RD-60-01	電子部品のフィールドデータの解析 (主として昭和57年～59年データについて)	5000	8000
RD-62-01	電子部品のフィールドデータについて (主として昭和59年～61年データについて)	5000	8000
SQA-10-01	エレクトロニックプロセス認証規格 (仮訳)	5000	8000
SQA-11-01	IEC QC001007-1-1 Revision E 第1-1部 航空宇宙産業: 部品マネジメント計画書のためのガイド	5000	8000
SQA-12-01	IEC QC 001007-1-2 (Revision G) 第1-2部 航空宇宙産業: 製造業者指定温度範囲外で半導体デバイスを使用するためのガイド (仮訳) IEC QC 001007-1-3 (Revision G) 第1-3部 航空宇宙産業: 電子機器の信頼性審査のためのガイド (仮訳)	5000	8000
SQA-13-01	平成13年度デバイス規格研究委員会調査報告書 電子機器の新しい信頼度予測方法ー PRISM ー付録: MIL-HDBK-217Fの全訳	5000	8000
SQA-4-01	A S I C及びI Cの製造業者認定と総合的品質管理 (T Q M) に関するガイドライン	5000	8000